附件：

审定项目表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 | 会议ID |
|  | 国标委发[2020]53号  20204892-T-469 | 半导体单晶晶体质量的测试 X射线衍射法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 审定 | 285-818-048 |
|  | 国标委发[2021]19号  20211950-T-469 | 半导体单晶晶向测定方法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]19号20211957-T-469 | 硅外延用三氯氢硅 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 审定 |